文章编号:1002-2082(2006)02-0167-04

基于MTF 的时间延迟积分CCD 成像系统同步误差分析

张 林1,2,吴晓琴2,汤宫民1

(1. 南京理工大学 机械工程学院,南京 210094; 2. 合肥学院,合肥 230022)

摘 要: 通过像移调制传递函数MTF 分析了TDI-CCD 行扫速率与运动像不同步时对相机成像质量的影响。为验证速度失配对TDI-CCD 相机成像质量的影响,针对应用环境,利用高对比度靶标对TDI-CCD 动态成像进行了仿真实验和动态测试,结果表明,在奈奎斯特频率范围内,只要将相机动态成像系统的同步误差控制在 $\pm2\%$ 的范围内,并使图像时钟处于连续多相的工作方式,就可以基本上消除同步误差对成像质量的影响。

关键词: TDI-CCD;同步误差;调制传递函数(MTF);像移

中图分类号: 0433.1

文献标志码:A

Analysis of synchronization error for time delayed integration (TDI) CCD imaging system based on MTF

ZHANG Lin^{1,2}, WU Xiao-qin², TANG Gong-min¹

(1. School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing 210094, China; 2. Hefei University, Hefei 230022, China)

Abstract: The negative effect of the mismatch between time delayed integration (TDI) CCD line scanning velocity and image motion on image quality is fully analyzed with phase-motion modulated transfer function (MTF). In order to verify the effect of the velocity mismatching on the image quality of 96-stage TDI-CCD camera, based on the application environment, the simulative experiment and dynamic testing for the dynamic imaging of the TDI-CCD camera were conducted by utilizing the target with high contrast characteristic. The results show that within the range of Nyquist frequency, the effect of the synchronization error on the imaging quality can be basically eliminated during the processing of imaging so long as the synchronous error is strictly controlled in the range of $\pm 2\,\%$ and the imaging clock is in the continuous four-phase operating mode.

Key words: TDI-CCD (time delayed integration charge coupled device); synchronous error; modulated transfer function(MTF); image motion

引言

CCD 作为一种新型的探测和成像器件,其应用已经深入到国民经济各个领域。特别在现代靶场

立靶测试和航天卫星的遥感遥测等领域具有广泛的应用。在线阵 CCD 交汇测量系统中,对于大靶面、高速飞行的小目标,常规 CCD 基本上搜索不到

收稿日期:2005-03-19; 修回日期:2006-01-11

基金项目:安徽省教育厅自然科研基金资助项目(2005kj090);合肥学院科研发展基金资助项目(05ky007zr)

目标的任何信息,而 TDI-CCD 可以在低照度下捕 获到动态目标的相关信息。TDI-CCD 的工作方式 比较特殊,在对动态目标成像时,要求它的行扫速 率与目标的运动速率严格同步。否则不能保证 TDI-CCD 同一列上的每一个像元都能对同一目标 成像,从而引起在延迟积分时间内的像移,如果同 步误差较大,会造成相机输出图像的混叠与模糊。 事实上,在现有的技术条件下严格同步是不可能 的。因此,如何公正客观地评价TDI-CCD 器件的成 像质量,无论是对CCD的使用者还是制造者来说, 都是一个极其重要而又尚待解决的问题。近年来的 研究表明,调制传递函数(MTF)仍然是目前评价 TDI-CCD 成像质量的可靠方法[1]。因此,对 TDI-CCD 相机的像移最大容许量以及速度失配与相机 的MTF 和像质的关系进行分析与实验是十分必要 的。本文通过建立像移调制传递函数 MTF 的数学 模型,重点分析了TDI-CCD 行扫速率与运动图像 不同步时产生的像移对相机成像质量的影响,并利 用高对比度测试靶标来模拟运动的图像,对像移影 响相机的 MTF 分别进行了动态测试与理论计算。 结果表明,对于 96 级 TDI-CCD 器件,当空间频率 在奈奎斯特频率范围内,且像移量被限制在一个像 素内,即同步误差控制在2%的范围内,就可以获得

1 TDI-CCD 的工作原理及像移分析

理想运动图像的像质。

TDI-CCD 是时间延迟积分电荷耦合器件,其 内部结构如图1所示。图1中的行数为延迟积分的 级数(M),其工作原理是:当沿着CCD 级数方向推 扫成像时,在第1个积分周期目标在某列第1个像 元曝光积分,得到的光生电荷下移1个像元;在第2个积分周期目标恰好移动到该列第2个像元处曝 光积分,得到的光生电荷与上一像元来的电荷相加 后移到下一像元…直到第 M 个积分周期目标移到 该列第 M 个像元曝光积分,产生的光生电荷与前 (M-1)个电荷相加后移入读出寄存器并读出。M列像元实际是 TDI-CCD 的同一列像元在 M 个积 分周期内对同一目标的曝光,TDI-CCD 级数方向 的电荷转移是靠外同步信号触发的,当CCD 像元 光生电荷包的转移速度与像的移动速度不匹配时, 就会产生像移。其像移通常可用2种形式表示:一 是在延迟积分时间内的总像移量S;二是在单个行 周期内由不同步采集所产生的像移量X。若把像移 分解为 TDI-CCD 行方向(线视场方向)的分量 S_R 和 ΔX_R 以及推扫方向(积分方向)上的分量 S_C 和 ΔX_C ,由于行方向上的像移数值很小可以忽略不计,则 TDI 积分方向上总像移量与单个行周期内的像移量的关系表达式为

移量的关系表达式为
$$S_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$$
 (1) $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes lpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + K imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \Delta X_C + M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \alpha$ 和 $P_C = M imes \alpha$ 为 $P_C = M imes \alpha$ 和 $P_C = M ime$

式中,M 为积分级数, α 为 CCD 像元的尺寸(设像元为正方形);K 为 TDI-CCD 在行周期内的曝光时间与行周期的比值; $K \times \alpha$ 的像移是由相机的推扫工作方式造成的。由(1)式可知,积分级数越高,产生像移越大。工作在突发模式的TDI-CCD 相机的 K 值由用户设定^[2],对于工作在连续模式的TDI-CCD 相机来说,其电荷沿 TDI 方向的转移是靠图像时钟来控制的。若成像转移时钟为 4 相驱动,则K 值为 1/4;若为 3 相驱动,则K 值为 1/4;若为 3 相驱动,则K 值为 1/3;若为 2 相驱动,则K 值为 1/2。显然,成像转移时钟相数越多,产生的像移越小。

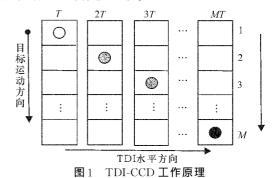


Fig. 1 The operational principle of TDI-CCD

2 基于MTF 的速度同步误差分析

2.1 TDI-CCD 像移的MTF

在线阵 CCD 交汇测量系统中产生 TDI-CCD 像移的原因很多,包括速率失配的不同步采集、振 动、光学系统的像差等。其中不同步采集带来的像 移是最主要因素,它随着积分级数的增加而线性增 加。这里考虑的是在延迟积分时间内总的像移,近 似认为像移是受速度失配的不同步采集影响,因速 度失配造成的像移对相机成像质量的影响可用调 制传递函数MTF 来衡量。由于垂直于TDI 方向上 的像移数值很小,为分析方便可忽略不计,所以速 度失配引起像移调制传递函数的退化仅仅考虑作 用于TDI 积分方向。对于一个M 级TDI-CCD,设电 荷转移的平均速度为V,像移速度为 V_I ,则速度失 配量为 $\Delta V = V - V_I$;设像元中心间距等于像元宽 度 α ,则电荷沿 TDI 积分方向转移 M 次后失配的距 离为 $S = M\alpha(\Delta V/V)$ 。式中, $\Delta V/V$ 为速度失配率, 即同步误差。令 $d = (\Delta V/V)$,则 $S = M\alpha d$ 。由此可 知,同步误差d 越大,引起的像移S 越大。若这里主要考虑速度失配效应,因此可看作一个宽度为 $M\alpha$ ($\Delta V/V$)的有限孔径采样一定空间频率 f 的静止波。那么由速度失配的线扩展函数 $L(x)=1/M\alpha(\Delta V/V)$,一 $\frac{M\alpha(\Delta V/V)}{2}$ <x< $\frac{M\alpha(\Delta V/V)}{2}$,可求得同步误差引起MTF 变化的数学模型为

$$MTF_{\Delta V} = \sin(\pi \alpha f M \frac{\Delta V}{V}) / (\pi \alpha f M \frac{\Delta V}{V})$$
 (2)

DALSA 公司的一份研究报告[3]表明,同步误 差对像质的影响可由 $M(\Delta V/V)$ 表示。当 $M(\Delta V/V)$ V)=0 时,即速度完全匹配,有MTF_{AV} ≈ 1 ,不影响 图像分辨率。对于 $M(\Delta V/V)=1$,在奈奎斯特频率 极限处 $f = f_n = 1/2 \ \alpha \ \text{时}, \text{MTF}_{\Delta V} = 0.64; 在 f =$ $2 f_n$ 时,MTF 已严重退化为 0。根据对 MTF 的要 求,只有成像系统的 MTF≥0.02 时,人眼才能分 辨。因此,这种退化一般认为是不可接受的。也就 是说,相机在空间频率高于奈奎斯特频率的条件下 工作,违反采样定理,图像会出现混叠效应。所以, 在对CCD调制函数进行分析时,工作频率尽可能 在奈奎斯特频率范围内。当 $M(\Delta V/V)=2$ 时,在奈 奎斯特频率极限处,MTF_{AV}=0。此时表明,同步误 差较大,引起MTF的严重衰减。所以,通常将M $(\Delta V/V) = 2$ 定义为 TDI-CCD 的速度失配容限;级 数越多,对运动速度的同步精度要求越高。对于工 作在96 级的TDI-CCD,则要求速度同步误差 $\Delta V/V$

图 2 为像元尺寸 α =13 μ m×13 μ m,在 TDI-CCD 积分方向上不同步采集时的不同像移量引起MTF 的衰减曲线。从图2 可以发现,同步误差d 越大,MTF 的值衰减越快。当不同步采集时的像移d=0.02 时,相机的MTF 值在CCD 奈奎斯特频率 f_n =38 lp/mm时已衰减为0,这种结果是难以接受的。

控制在±2%以内。

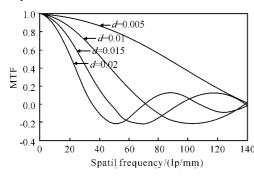


图 2 TDI-CCD 积分方向上的像移量对 MTF 的影响 Fig. 2 Effect of length of image motion in the direction of TDI-CCD integration on MTF

所以, $d = \Delta V/V < 2\%$ 成为 TDI-CCD 同步控制要求的一个重要设计依据。

2.2 像移对成像质量的评价

从图 2 可以看到,像移对 TDI-CCD 相机 MTF 的 影响是比较严重的,但仅靠 MTF 曲线很难完全 理解像质的变化。目前,图像系统的性能越来越多 地采用美国国家图像解释分级标准 NIIRS (the National Image Interpretability Rating Scale)来描述。像移 S_C 对 NIIRS 的影响可用如下经验公式表示 [4]

NIIRS_{loss}=0.003 1-0.0630
$$S_C$$
-
0.005 9 S_C ²
(3)

式中, $S_c = M \times \Delta X_c + K \times \alpha$ 为像移量,单位为像素。为便于分析,用 Δ NIIRS 表示 NIIRS_{loss}。当 Δ NIIRS<0.1 时,感受不到图像质量的变化;当 $0.1 \le \Delta$ NIIRS<0.2 时,可以感受到像质的变化;当 Δ NIIRS<0.2 时,像质会有明显的变化。按照以上标准,随着像移量不断增大,NIIRS 损失也随着增大。当像移量 $S_c < 1$ 个像素时, Δ NIIRS<0.1,感受不到图像质量的变化;当像移量 $S_c = 2.64$ 像素时, Δ NIIRS=0.2,对像质产生一定影响;当像移量 $S_c > 3$ 个像素时, Δ NIIRS>0.2,像质的影响不可接受。

3 仿真实验与分析

为了验证速度失配对TDI-CCD 相机成像质量 的影响,本文对M=96级的TDI-CCD 动态成像进 行了仿真实验。针对应用环境,利用高对比度靶标 对CCD 相机的MTF 进行动态测试[5-6]。对于CCD 相机的空间分辨率特性,通常用调制传递函数来表 征。在宏观上可以认为光电成像系统是一个线性不 变系统。因此,相机系统的MTF可以由各个分系统 的MTF相乘得到。当正弦靶标经过镜头成像后再 被CCD 采样成像,相机系统的调制传递函数为2 者 的乘积,即MTF_{SYS}=MTF_{OPTICS}MTF_{CCD}。由于正弦 靶标很难制造,实际应用中常用矩形靶标来代替。 按照傅里叶变换原理的光传递函数理论,MTFcc $=\sin(\pi\alpha f)/\pi\alpha f$ 。若 $f=1/2\alpha$,MTF_{CCD} $=2/\pi=$ 0.636 6,MTF_{SYS}=0.636 6 MTF_{OPTICS}。根据调制 传递函数 MTF 的定义[5],相机系统的调制传递函 数可表示为 $MTF_{OPTICS}(f) = M_a/M_i$ 。式中, M_i 为 目标的输入调制度; M_e为图像的输出调制度。对 于高对比度靶标,可以近似认为 M_i 为1。因此, M_a 即可认为是相机系统的MTF,它随着成像质量的

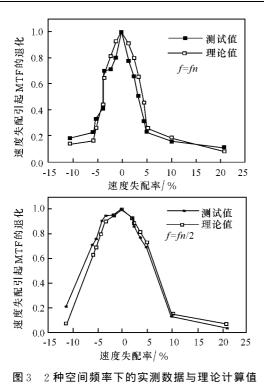


Fig. 3 Datafrom test and values from theoretical calculation in case of two spatial frequencies 改变而发生变化。通过在成像测试过程中对相机输出调制度分别进行实时和理论计算[7],可以得到CCD 在2 种空间频率下因速度失配引起MTF 的退化曲线(如图3 所示)。图中基于调制传递函数的理论分析值与实验测试值基本上是一致的,其存在的

差别主要是靶标在成像时由 CCD 光敏元与靶标之间的相对位置变化而造成的。从对相关测试数据所进行的分析可以看出,在奈奎斯特频率 fn 的范围内,空间频率越小,MTF 值衰减的越慢。当采用 96级 延迟积分的 TDI-CCD 器件,速度失配只有控制在 $\pm 2\%$ 的范围内,MTF 值的退化才会不明显,成像质量才能得到保证。

参考文献:

- [1] 宋敏,郐新凯,郑亚茹.非理想情况下的CCD调制传递函数的综合表示方法[J].光学技术,2003,29(6):
- [2] 刘良云,张伯珩,李英才,航天 TDI-CCD 相机的 MTF 和像质分析[J]. 光学技术,2000,26(6):481-483.
- [3] DALSA CORP. CCD Image Sensors Databook[M]. Canada: DALSA Corp, 1999.
- [4] SMITH S L, MOONEY J, TANTALO T A, et al. Under-standing image quality losses due to smear in high-resolution remote sensing imaging system [J]. Opt Eng, 1999, 38(5):821-826.
- [5] 杨桦,朱永红,焦文春,等. CCD 的输出响应与相机 MTF测试[J]. 光学技术,2001,27(5):444-446.
- [6] 万春明,佟首峰. CCD 相机调制传递函数的测试原理 分析[J]. 半导体光电,2002,23(1):40-43.
- [7] 杨桦,朱永红,焦文春,等. TDI-CCD 成像的速度同步 分析和实验[J]. 航天返回与遥感,2003,24(1):38-42.



联姻行业权威,加强国际合作

"武汉·中国光谷"与美国国际光学工程学会达成全面合作协议

2006 年2 月23 日,武汉东湖新技术开发区管委会与美国国际光学工程学会(SPIE)在武汉香格里拉大饭店就双方科技交流与合作、国际会展、人才培训等方面的合作签署合作备忘录,这标志着国际最大的光电权威机构与"武汉・中国光谷"的合作全面启动。武汉市委常委副市长袁善腊、东湖新技术开发区管委会主任唐良智、美国国际光学正程学会主席麦克马拉蒙博士、执行主席亚瑟博士等出席了签字仪式。

美国国际光学工程学会是致力于光电子信息领域研究和应用的国际著名专业机构,成立五十余年来在全球有超过15 000 名正式会员,该组织每年举办350 多次国际性专业技术研讨会以及各种培训教学活动,所发表的会议文献反映了国际光电行业领域的最新进展和动态,具有极高的学术价值。由该机构主办的"亚太光通信及无线通信学术会议暨展览会"(APO)是当今全球最权威的光电子行业盛会之一。国际光学工程学会早在2003 年便与"武汉·中国光谷"国际光电子博览会进行了首度合作,同时对"武汉·中国光谷"的发展表现出极大的关注。

据悉,此次双方协议的合作领域十分广泛,除了联手打造武汉"光博会"品牌之外,还将在武汉地区联手举办一系列的国际学术会议、国际展览、研讨讲习班等,国际光学工程学会也将在其发起的众多国际活动中为东湖开发区的科研技术人员提供国际交流的机会。

(武汉东湖开发区生产力促进中心 张佳)